

УДК 537.311.322

© 1990

## АНИЗОТРОПИЯ РАССЕЯНИЯ НОСИТЕЛЕЙ ЗАРЯДА В ТВЕРДЫХ РАСТВОРАХ $\text{Bi}_2\text{Te}_{3-x}\text{Se}_x$ и $\text{Bi}_{2-y}\text{In}_y\text{Te}_3$

B. A. Кутасов, Л. Н. Лукьянова

В твердых растворах на основе теллурида висмута ( $\text{Bi}_2\text{Te}_{3-x}\text{Se}_x$ ,  $x=0.12, 0.3$ ;  $\text{Bi}_{2-y}\text{In}_y\text{Te}_3$ ,  $y=0.06, 0.12$ ) из данных по измерению компонентов тензора сопротивления  $\rho_{ij}$ , эффекта Холла  $\rho_{ijk}$  и магнетосопротивления  $\rho_{ijkl}$  в слабых магнитных полях определены отношения компонентов тензора времени релаксации  $\tau_{ij}/\tau_{11}$  в соответствии с многодолинной моделью энергетического спектра с анизотропным рассеянием носителей заряда. Установлено, что анизотропия рассеяния увеличивается с ростом концентрации носителей, при этом анизотропия рассеяния выше в твердых растворах  $\text{Bi}_{2-y}\text{In}_y\text{Te}_3$  с ограниченной растворимостью второго компонента, чем в непрерывных твердых растворах. Показано, что анизотропия рассеяния в плоскости спайности меньше, чем в перпендикулярном направлении.

Твердые растворы на основе  $\text{Bi}_2\text{Te}_3$  с соединениями  $\text{Bi}_2\text{Se}_3$  и  $\text{In}_2\text{Te}_3$  обладают сильной анизотропией кинетических явлений, обусловленных как анизотропией эффективной массы, так и анизотропией рассеяния носителей заряда, возникающей вследствие анизотропии упругих колебаний кристалла, что приводит к необходимости введения тензора времени релаксации при анализе экспериментальных данных.

Анизотропия рассеяния носителей заряда в твердых растворах  $\text{Bi}_2\text{Te}_{3-x}\text{Se}_x$  ( $x=0.12, 0.3$ ) и  $\text{Bi}_{2-y}\text{In}_y\text{Te}_3$  ( $y=0.06, 0.12$ )  $n$ -типа проводимости была исследована на основании данных измерений компонентов тензоров эффекта Холла  $\rho_{ijk}$  и магнетосопротивления  $\rho_{ijkl}$  в слабых магнитных полях совместно с сопротивлением  $\rho_{ij}$ . Интерпретация полученных результатов проводилась в соответствии с многодолинной моделью энергетического спектра с анизотропным рассеянием носителей заряда [1-3], когда компоненты тензора времени релаксации  $\tilde{\tau}(\varepsilon)$  можно представить в виде

$$\tau_{ij} = \varphi(\varepsilon) \tilde{\tau}_{ij}, \quad (1)$$

где  $\varphi(\varepsilon)$  — изотропная функция, зависящая только от энергии  $\varepsilon$ ;  $\tilde{\tau}_{ij}$  — анизотропный множитель, не зависящий от энергии и направления движения электрона.

При расчетах отношений компонентов тензора  $\tilde{\tau}$  в рамках многодолинной модели связь между экспериментальными гальваномагнитными коэффициентами  $\rho_{ij}$ ,  $\rho_{ijk}$ ,  $\rho_{ijkl}$  и параметрами  $u$ ,  $v$ ,  $w$ , определяющими форму поверхности постоянной энергии, имеет вид [1, 4]

$$\rho_{312}/\rho_{123} = y_1(u, v, w) = (w + uv)(1 + u)/4uv,$$

$$\rho_{11}\rho_{1111}/\rho_{123}^2 = y_2(u, v, w, \beta) = (w - 5uw + 3uv + u^2v)(1 + u)/16v^2u^2,$$

$$\rho_{11}\rho_{1122}/\rho_{123}^2 = y_3(u, v, w, \beta) = \frac{(3w + uw + uv + 3u^2v)(1 + u)}{16v^2u^2} - \frac{2v}{u^2(1 + u)},$$

$$\rho_{11}\rho_{1133}/\rho_{123}^2 = y_4(u, \beta) = (1 + u)^2/4u\beta - 1, \quad (2)$$

где  $u, v, w$  параметры связаны с компонентами тензора обратных эффективных масс  $\tilde{\alpha}$

$$u = \alpha_{11}/\alpha_{22}, \quad v = \alpha_{33}/\alpha_{22}, \quad w = \alpha_{23}^2/\alpha_{22}^2. \quad (3)$$

Угол поворота главных осей эллипсоидов постоянной энергии относительно кристаллографических осей определен следующим образом:

$$\operatorname{tg} 2\theta = 2\alpha_{23}/(\alpha_{22} - \alpha_{33}). \quad (4)$$

Параметр вырождения  $\beta$  определен в соответствии с [5, 6] через отношения  $I_1, I_2$  в виде

$$\beta = I_1^2/I_0 I_2, \quad (5)$$

где

$$I_n = \left( \frac{e}{m} \right)^n \frac{e^2}{3\pi^2 m} \left( \frac{2m}{\pi^2} \right)^{3/2} \frac{1}{|\alpha_{ij}|^{1/2}} \int_0^\infty \tau^{n+1} \varepsilon^{3/2} \frac{\partial f_0}{\partial \varepsilon} d\varepsilon,$$

$|\alpha_{ij}| = \alpha_{11} (\alpha_{22} \alpha_{33} - \alpha_{23}^2)$  — детерминант, составленный из компонентов тензора обратных эффективных масс  $\tilde{\alpha}$ .

Как было показано в работе [7], использование анизотропного времени релаксации при анализе гальваномагнитных коэффициентов  $\rho_{ij}, \rho_{ijk}, \rho_{ijkl}$  приводит к замене  $\alpha_{ij}$  на произведения  $(\alpha_\tau)_{ij}$  в формулах (2)–(4). Тогда в соответствии с [8] соотношения между компонентами тензора обратных эффективных масс для анизотропного и изотропного времени релаксации имеют вид

$$\begin{aligned} \alpha'_{11} &= \gamma_1, \quad \alpha'_{22} = c^2 \gamma_2 + s^2 \gamma_3 - sc (\gamma_4 - \gamma_5), \quad \alpha'_{33} = s^2 \gamma_2 + c^2 \gamma_3 + sc (\gamma_4 - \gamma_5), \\ \alpha'_{23} &= sc (\gamma_2 - \gamma_3) + c^2 \gamma_4 - s^2 \gamma_5, \quad \alpha'_{32} = sc (\gamma_2 - \gamma_3) + c^2 \gamma_5 - s^2 \gamma_4, \end{aligned} \quad (6)$$

где

$$\gamma_1 = \alpha_{11} \tau_{11}, \quad \gamma_2 = \alpha_{22} \tau_{22}, \quad \gamma_3 = \alpha_{33} \tau_{33}, \quad \gamma_4 = \alpha_{23} \tau_{23}, \quad \gamma_5 = \alpha_{32} \tau_{32}, \quad c = \cos \theta, \quad s = \sin \theta, \quad (7)$$

$\theta$  — угол поворота главных осей эллипсоидов постоянной энергии относительно кристаллографических осей.

Из соотношений Онзагера следует [7], что  $\alpha'_{23} = \alpha'_{32}$ , т. е.  $\gamma_4 = \gamma_5$ , что упрощает (6).

Таким образом, анизотропия рассеяния носителей заряда может быть учтена при замене  $\alpha_{ij}$  в выражениях (2), (3) на  $\alpha'_{ij}$  из (6). Из системы уравнений (6) с учетом (3), (4) можно получить [8]

$$\begin{aligned} \gamma_2/\gamma_1 &= \frac{c^2}{u} + \frac{s^2 v}{u} + 2sc(v-w)^{1/2} u, \\ \frac{\gamma_3}{\gamma_1} &= \frac{s^2}{u} + \frac{c^2 v}{u} - \frac{2sc(v-w)^{1/2}}{u}, \\ \frac{\gamma_4}{\gamma_1} &= \frac{-sc(1-v)}{u} + \frac{(c^2 - s^2)(v-w)^{1/2}}{u}. \end{aligned} \quad (8)$$

Как следует из (7), (8), величины  $\alpha_1, \tau_{11}, \alpha_{22} \tau_{22}, \alpha_{33} \tau_{33}, \alpha_{23} \tau_{23}$  и угол  $\theta$  дают полную информацию о рассеянии носителей заряда и зонной структуре исследуемых материалов.

Определение компонентов тензора  $\tilde{\alpha}$  возможно только при совместном анализе экспериментальных данных по гальваномагнитным коэффициентам, измеренным как в слабом, так и в сильном магнитных полях, поскольку из осцилляционных эффектов в случае сильного магнитного поля могут быть определены компоненты тензора обратных эффективных масс  $\tilde{\alpha}$ . В работе [2] при анализе слабопольных гальваномагнитных коэффициентов с целью определения отношений компонентов тензора  $\tilde{\alpha}$  в  $\text{Bi}_2\text{Te}_3$  использовалось предположение о том, что при комнатной температуре рассеяние носителей заряда близко к изотропному вследствие компенсации анизотропии рассеяния фононов анизотропией их энергетического

спектра. При этом вклад примесного рассеяния не учитывался. В области низких температур вклад примесного рассеяния возрастает, причем компенсация анизотропии рассеяния анизотропией примесных центров отсутствует из-за их хаотического расположения в отличие от фононного рассеяния. В этом случае время релаксации должно быть анизотропным. Предположение об изотропном рассеянии в [2] при комнатной температуре критиковалось в работе [9], где на основании данных слабо- и сильноупорядоченных гальваномагнитных коэффициентов были определены компоненты  $\tilde{\tau}$  для  $p\text{-Bi}_2\text{Te}_3$ . Однако из данных, полученных в работе [9], следует, что ошибка в определении отношений диагональных компонентов тензора  $\tilde{\tau}$  в предположении изотропного времени релаксации при комнатной температуре составляет не более 20%, что вполне приемлемо для качественного анализа анизотропии рассеяния исследуемых материалов. Ошибка в определении недиагональных членов может быть выше, поэтому в настоящей работе мы ограничивались только рассмотрением отношений  $\tau_{22}/\tau_{11}$  и  $\tau_{33}/\tau_{11}$ .

На рис. 1, 2 представлены температурные и концентрационные зависимости величины  $\rho_{11}\rho_{1133}/\rho_{123}^2$  — одного из отношений вида  $\rho_{ij}\rho_{jkl}/\rho_{ijk}^2$ , изменения которого от температуры и концентрации носителей  $n$  характерны и для отношений  $\rho_{11}\rho_{1122}/\rho_{123}^2$  и  $\rho_{11}\rho_{1111}/\rho_{123}^2$ . Полученные изменения величины

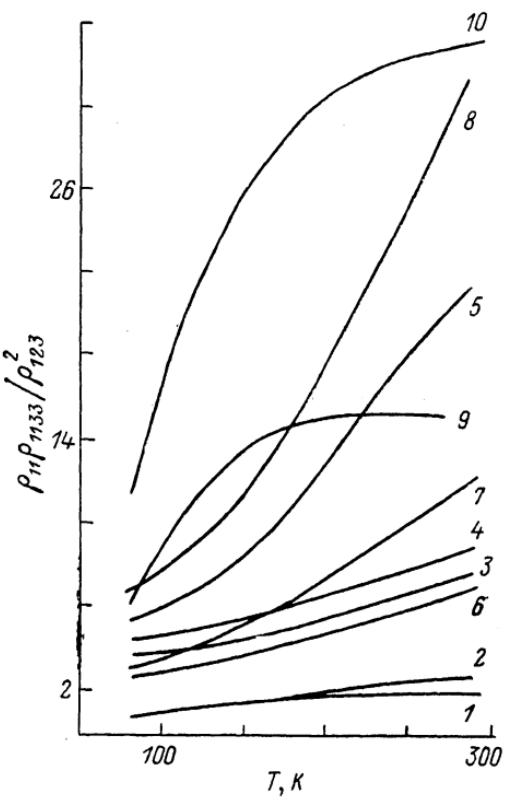


Рис. 1. Температурные зависимости отношения  $\rho_{11}\rho_{1133}/\rho_{123}^2$  в твердых растворах  $\text{Bi}_2\text{Te}_{3-x}\text{Se}_x$  (1—8) и  $\text{Bi}_{2-y}\text{In}_y\text{Te}_y$  (9, 10).

$n \cdot 10^{-18}, \text{ см}^{-3}$ : 1 — 1.5, 2 — 2.5, 3 — 5, 4 — 15, 5 — 29 ( $x=0.12$ ); 6 — 4, 7 — 11, 8 — 16 ( $x=0.3$ ), 9 — 2.5, 10 — 8 ( $y=0.06$ ).

$\rho_{11}\rho_{1133}/\rho_{123}^2$  от  $T$  и  $n$  указывают на применимость для исследованных твердых растворов двухзонной модели энергетического спектра с анизотропным рассеянием, поскольку в случае однозонной модели с изотропным рассеянием отношения  $\rho_{ij}\rho_{jkl}/\rho_{ijk}^2$  не зависят от  $n$ , как это было показано в работе [8] для  $\text{Bi}_3\text{Te}_3$ . В случае двухзонной модели величина  $\rho_{11}\rho_{1133}/\rho_{123}^2$  возрастает с ростом  $n$ . В области низких концентраций носителей ( $n < 3 \cdot 10^{18} \text{ см}^{-3}$ ), где еще нет влияния дополнительной зоны, изменения  $\rho_{11}\rho_{1133}/\rho_{123}^2$  указывают на анизотропию рассеяния носителей заряда в основной зоне. При более высоких значениях  $n$  изменения  $\rho_{11}\rho_{1133}/\rho_{123}^2$  обусловлены одновременным действием двух причин: влиянием второй зоны и анизотропией рассеяния носителей заряда. Наблюдавшиеся изменения наклона зависимостей  $\rho_{11}\rho_{1133}/\rho_{123}^2$  от температуры (рис. 1, кривые 9, 10) в области температур, близких к температуре Дебая ( $T_D = 165 \text{ K}$  для  $\text{Bi}_2\text{Te}_3$ ), в твердых растворах, содержащих In, по сравнению с  $\text{Bi}_2\text{Te}_{3-x}\text{Se}_x$  могут быть связаны с изменением вклада электрон-фононного взаимодействия в процессы рассеяния. На существование дополнительной зоны и анизотропный механизм рассеяния указывает также зависимость удельного сопротивления  $\rho_{11}$  от концентрации носителей (рис. 2, кривые 1, 2), где отклонение от линейности в зависимости  $\rho_{11}$  от  $n$ , возни-

кающее при  $n \geq 3 \cdot 10^{18} \text{ см}^{-3}$ , является одним из доказательств существования второй зоны и анизотропного рассеяния. Полученные в соответствии с формулами (6)–(8) отношения произведений компонентов тензора обратных эффективных масс на компоненту тензора времени релаксации  $\gamma_i/\gamma_1$  и отношения компонентов тензора времени релаксации  $\tau_{ij}/\tau_{11}$  представлены на рис. 3. Величины  $\gamma_i/\gamma_1$  и  $\tau_{ij}/\tau_{11}$  были получены в результате решения системы уравнений (2) градиентным методом наименьших квадратов относительно независимых параметров  $u, v, w, \beta$ .

Изменения  $\gamma_i/\gamma_1$  в зависимости от  $n$  в твердых растворах  $\text{Bi}_2\text{Te}_{2.88}\text{Se}_{0.12}$  (рис. 3, кривые 1, 3) при переходе из области низких концентраций носителей в область высоких  $n$ , наблюдавшиеся для отношений  $\gamma_2/\gamma_1$  и  $\gamma_3/\gamma_1$ ,

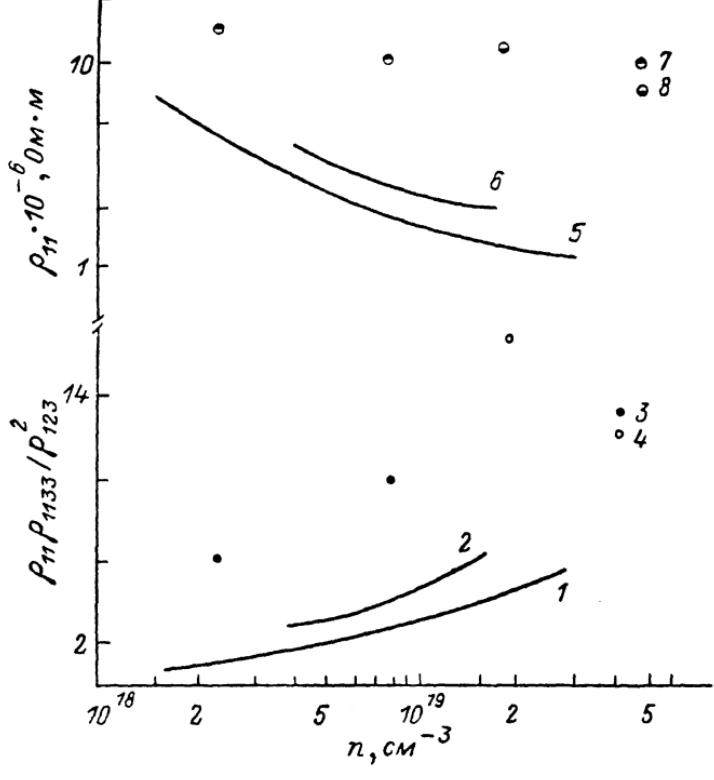


Рис. 2. Концентрационные зависимости отношений  $\rho_{11}\rho_{1133}/\rho_{123}^2$  (1–4) и удельного сопротивления  $\rho_{11}$  (5–8) при 77 К в твердых растворах  $\text{Bi}_2\text{Te}_{3-x}\text{Se}_x$  и  $\text{Bi}_{2-y}\text{In}_y\text{Te}_3$ .  
 $x: 1, 5 - 0.12; 2, 6 - 0.3. y: 8, 7 - 0.06, 4, 3 - 0.12.$

указывают на существование дополнительной зоны в зоне проводимости исследуемых твердых растворов, заполнение которой происходит при  $n \approx 3 \cdot 10^{18} \text{ см}^{-3}$ .

Для твердого раствора  $\text{Bi}_2\text{Te}_{2.7}\text{Se}_{0.3}$  (рис. 3, кривая 2) изменений  $\gamma_i/\gamma_1$  в зависимости от концентрации носителей заряда обнаружено не было, поскольку все исследованные образцы относятся к области высоких концентраций ( $n > 3 \cdot 10^{18} \text{ см}^{-3}$ ). Отношения  $\gamma_4/\gamma_1$  (рис. 3, кривая 4) имели близкие значения для всех твердых растворов и не зависели от концентрации  $n$ .

Из концентрационных зависимостей отношений  $\tau_{ij}/\tau_{11}$  следует (рис. 3, кривые 1–6), что анизотропия рассеяния носителей заряда в исследованных твердых растворах выше, чем в  $\text{Bi}_2\text{Te}_3$ , и возрастает с ростом концентрации носителей заряда; при этом анизотропия рассеяния выше в твердом растворе  $\text{Bi}_{2-y}\text{In}_y\text{Te}_3$ , чем в  $\text{Bi}_2\text{Te}_{3-x}\text{Se}_x$ . Отношения  $\tau_{23}/\tau_{11}$  не приведены на рис. 3, поскольку точность определения этого отношения невелика, однако величина  $\tau_{23}/\tau_{11}$  много меньше, чем  $\tau_{22}/\tau_{11}$  и  $\tau_{33}/\tau_{11}$  для всех ис-

следованных образцов, т. е. анизотропия рассеяния в плоскости спайности (0001) существенно меньше, чем в перпендикулярном направлении <111>.

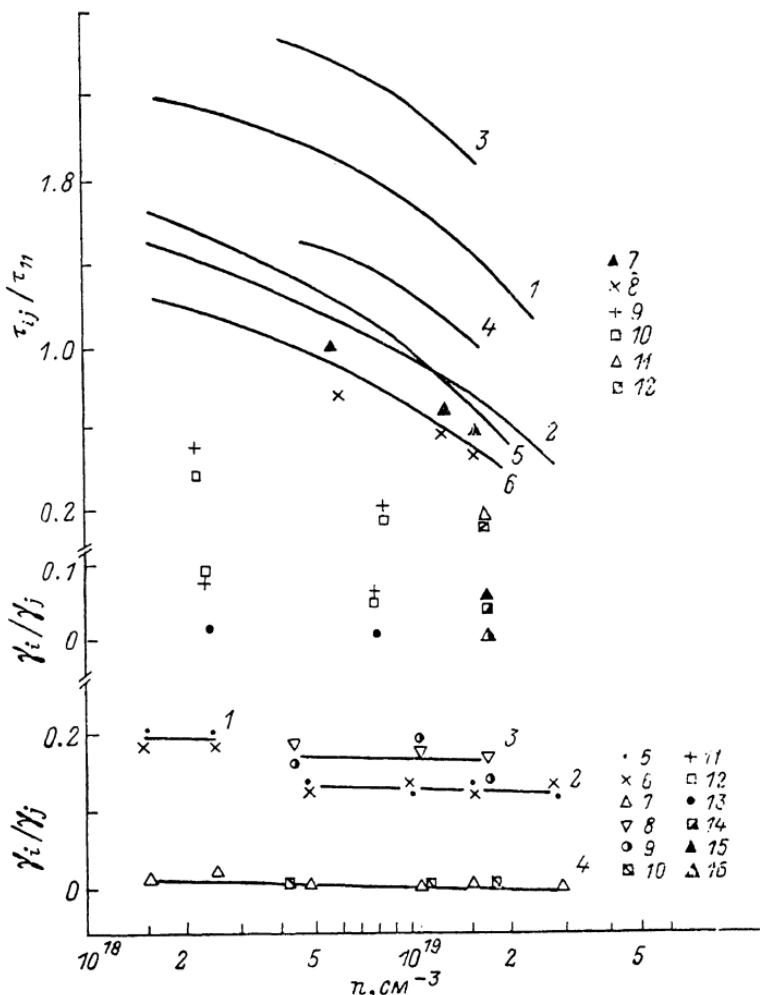


Рис. 3. Концентрационные зависимости величины  $\gamma_i/\gamma_j$  и отношений компонентов тензора времени релаксации  $\tau_{ij}/\tau_{11}$  при 77 К в твердых растворах  $\text{Bi}_{2-x}\text{Se}_x \cdot \text{Bi}_{2-y}\text{In}_y\text{Te}_3$ .

$\tau_{ij}/\tau_{11}$ : 1 —  $\tau_{22}/\tau_{11}$ , 2 —  $\tau_{33}/\tau_{11}$  ( $x=0.12$ ), 3 —  $\tau_{33}/\tau_{11}$ , 4 —  $\tau_{33}/\tau_{11}$  ( $x=0.3$ ), 5 —  $\tau_{22}/\tau_{11}$ , 6 —  $\tau_{33}/\tau_{11}$  [1], 7 —  $\tau_{22}/\tau_{11}$ , 8 —  $\tau_{33}/\tau_{11}$  (наст. раб.,  $x=0.0$ ), 9 —  $\tau_{22}/\tau_{11}$ , 10 —  $\tau_{22}/\tau_{11}$  ( $y=0.06$ ), 11 —  $\tau_{33}/\tau_{11}$ , 12 —  $\tau_{33}/\tau_{11}$  ( $y=0.12$ ).  $\gamma_i/\gamma_j$ : 1, 2 построены по значениям для 5, 6 (см. ниже); 3, 4 по значениям 7—10 соответственно; 5 —  $\gamma_2/\gamma_1$ , 6 —  $\gamma_3/\gamma_1$ , 7 —  $\gamma_4/\gamma_1$  ( $x=0.12$ ), 8 —  $\gamma_2/\gamma_1$ , 9 —  $\gamma_3/\gamma_1$ , 10 —  $\gamma_4/\gamma_1$  ( $x=0.3$ ), 11 —  $\gamma_2/\gamma_1$ , 12 —  $\gamma_3/\gamma_1$ , 13 —  $\gamma_4/\gamma_1$  ( $y=0.06$ ), 14 —  $\gamma_2/\gamma_1$ , 15 —  $\gamma_3/\gamma_1$ , 16 —  $\gamma_4/\gamma_1$  ( $y=0.12$ ).

#### Список литературы

- [1] Drabble J. R., Groves R. D., Wolfe R. // Proc. Phys. Soc. 1958. V. 71. N 3. P. 430—443.
- [2] Ефимова Б. А., Новиков В. И., Остроумов А. Г. // ФТТ. 1962. Т. 4. № 1. С. 302—304.
- [3] Asworth H. A., Rayne J. A. // Phys. Rev. B. 1971. V. 3. N 8. P. 2646—2661.
- [4] Caywood L. P., Miller G. R. // Phys. Rev. 1970. V. 2. N 8. P. 3210—3220.
- [5] Drabble J. R., Wolfe R. // Proc. Phys. Soc. 1956. V. 69 B. N 11. P. 1101—1110.
- [6] Коренблит И. Я. // ФТТ. 1960. Т. 2. № 12. С. 3083—3091.
- [7] Herring G., Vogt E. // Phys. Rev. 1956. V. 101. N 3. P. 944—981.
- [8] Mackey H. J., Sybert J. R. // Phys. Rev. 1968. V. 172. N 3. P. 603—607.
- [9] Testardi L. P., Burstein E. // Phys. Rev. B. 1972. V. 6. N 2. P. 460—469.